# ミクロスコーピックな視点から見た核燃料中での希ガス析出挙動の解明

# Study on the Behavior of Precipitated Noble Gases in Nuclear Fuel from View Point of Microscopic analysis

芹澤弘幸 A),大石佑治 B),安永和史 C), Hiroyuki Serizawa A),Yuji Ohishi B),Kazufumi Yasunaga C) A) Japan Atomic Energy Research Institute B) Osaka University C)The Wakasa Wan Energy Research Center

#### Abstract

We are studying the variation of morphology of FCC-type material by the precipitation of He using CeO<sub>2</sub> (001) thin film which was heat treated at 1273 K for 2h. The films were irradiated with 130-keV He4+ ions using 400-keV ion implanter of TIARA. The ion doped film was heat treated at 1773 K for 2 h in air. After the heat treatment, the sample was prepared for STEM analysis by FIB. It was found that many blisters are formed on the surface of the thin film. The blisters are considered to be formed by gas babble accompanied by the precipitation of He beneath the surface. The lid of the blister is blown away since the sample is ceramics. Many gas babbles are formed in the thin film. The size of the gas bubble falls within the range from 30 to 100 nm in diameter. The shape of the gas bubble is truncated octahedron but clearly different from that of void, which mean that the existence of He in the gas bubble effect on the shape of the gas bubble.

Keyword: Negative crystal, CeO2, STEM, Gas bubble

#### 1. 緒言

我々は、実験的に再現することが難しいために現象論的議論に止まらざるをえなかった燃料中でのFPガス析出挙動に関する研究の第一弾として、プルサーマル燃料中でのHe 挙動に注目した研究を展開している。「プルサーマル計画」は、使用済み燃料を再処理してU、Puを抽出し、これを用いて製造した MOX 燃料を商用軽水炉で燃料として使用する計画である。実際の照射は始まってはいるものの、

海外で製造された MOX 燃料は、国内に輸送後、 照射の可否の議論等により、その貯蔵期間は 長いもので既に15年を越えている。福島第一 原発事故の影響により、今後も照射が延期さ れる可能性は高く、更に貯蔵期間は長期化す ると考えざるをえない。貯蔵が長期に及んだ 場合、Pu から放出される He の影響を考慮し なければならない。

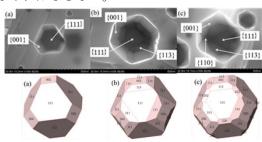


Figure 1. Three-types of the Negative Crystal

<sup>#</sup>serizawa.hiroyuki@jaea.go.jp

#### [H27-6]

He は、燃料中で析出すればスエリングを誘 発し、pellet-cladding mechanical interaction (PCMI)の原因となる。再処理燃料中での He 挙動に関する研究は、主として軽水炉用 MOX 燃料の使用実績のある、フランス及びドイツ が牽引する形で進められている。フランスで は、イオン照射により UO2に He を注入した 試料を用いて、He が octahedral サイトに固溶 すること、及び粒界拡散係数が粒内拡散係数 に比べてはるかに大きいこと、並びに He ガス バブル形成にはしきい温度が存在することを 明らかにした $^{[1,2]}$ 。ドイツでは、 $238PuO_2$  に蓄 積された He を用いた拡散挙動の解明が進め られている<sup>[3]</sup>。スウェーデンでは、第一原理計 算による He クラスターの構造解析及び、拡散 機構の解明が進められている[4]。我が国では、 Serizawa 等が MA-MOX 燃料の観点から He 挙 動を研究すべく、競争的資金[文部科学省原子 カシステム開発事業(平成23年終了)及び科 研費基板研究 A (平成 25 年終了) ]をベースと して研究を展開した。その結果、FP ガス元素 と異なり、粒内にガスバブルを形成すること なく燃料ペレットから放出されると考えられ てきた He が、実はガスバブルを形成してスエ リングを誘発するという工学的に重要な成果 と共に、形成されたガスバブルが温度上昇に より負結晶に変化するという自然科学的に興 味深い知見を得ることに成功した。多面体形 状の負結晶は、He 析出時の焼鈍温度に依存し て、Figure 1 に示すように変形した。Serizawa 等は、その変形が He 析出による負結晶内部の 内圧変化に起因するものであること、及び負 結晶の形状を議論するためには、負結晶を構 成する格子面の成長速度を考慮した Step Free Energy Model を導入する必要があることを明 らかにした。また表面積の効果により、{111} 及び {001} からなる立方八面体の負結晶が形 成されないことを明らかにしたのも興味深い 成果である<sup>[5,6]</sup>。しかしながら、He ガスバブル に由来するスエリングを抑制する方法につい てはこれまで全く議論されていない。そこで 我々は、セラミックス中に発現するガスバブ ルの臨界核に注目した。ガスバブルが臨界核 のサイズを越えない場合、消滅して He はペレ ット表面から放出される。我々は、He ガスバ ブルの臨界核サイズを評価して、析出した He が形成するガスバブルがそのサイズに到達し ない条件を明らかにすることができればスエ リングを回避できると考えた。本研究成果は、 米国で近々開始される燃料中での Xe の挙動 に関する研究とも密接に関係するため、 Argonne National Laboratory (ANL) の研究チ ームから、共同研究の打診を受け、これを受 諾している。本年度は、バルクサイズの CeO<sub>2</sub> を太陽炉によって製造し、ミリオーダーの単 結晶中での He 析出挙動を調べる予定だった。

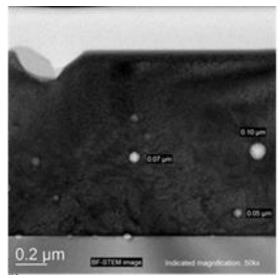


Figure 2. BF-Cross sectional BF-STEM image of He doped film

た めに、太陽炉での試験時間が十分とれず、成 功には至らなかった。本校では、並行して実

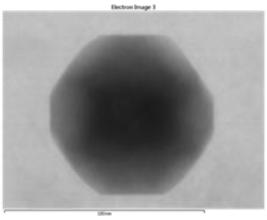


Figure. 3 STEM image of the gas babble 施した CeO2薄膜にイオン注入したヘリウムの析出挙動を、FIB-SEM 及び STEM によって観察した結果を報告する。

#### 2. 実験方法

スパッタ法により、 $CeO_2$  薄膜(膜厚 800 nm)を  $SrTiO_3(001)$ 基板上に製膜し、マッフル炉で 2 時間、 $1000^{\circ}$ Cでアニールした。 $CeO_2$  は高温では容易に還元されてしまうため、薄膜試料のアニールは空気中で行った。高崎量子応用研究所のイオン注入装置により、薄膜試料に室温で 130 keVのヘリウム $(3.75x10^{15}/cm^2)$ をイオン注入した後、大気中  $1500^{\circ}$ Cで 2 時間アニールしてヘリウムを放出させた。薄膜表面を FIB-SEM で、薄膜断面を TEM 観察した。

### 3. 結果及び考察

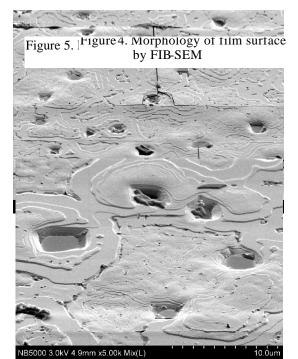
He イオンを照射した後、アニールした薄膜を、FIB によって加工した薄膜断面の STEM像を Figure 2 に示す。試料断面には、キャビティーが多数観察された(Figure 中白点)。キャビティーのサイズは直径数十~100nm であり、He のイオン注入量が最も多い薄膜中央部分で、特に大きなキャビティーの成長が見られた。

キャビティーの STEM 像((100)方向)を Figure 3 に示す。発現したキャビティーは、その切り口が 6 角形であることから、Figure 1. に示した多面体構造のうち、(111)及び(100)から構成される 14 面体構造構造(右端)であることがわかる。キャビティーがボイドの集積だけによって形成されたものとすると、その形状は Wulff-shape をとるものと考えられる。結晶構造が同じであることから、 $CeO_2$  単結晶の Wulff-shape は、 $UO_2$ の単結晶の Wulff-shape とほぼ同じであると考えて良い。Castel によって報告された  $UO_2$ の Wulff-shape は、その表面自由エネルギーの高い(100)よりも(111)が選択

Figure 4. Morphology of film surface examined by FIB-SEM

的に成長しており、全表面積に占める割合は大きくなる。 $^{[7]}$ 。したがって、Wulff-shape の (100)方向の断面は、Figure 3 のキャビティーのような正六角形に近い形状にはならない。 Serizawa 等は、気相法で作成した  $UO_2$  単結晶を用いた実験で、(100)が成長する原因が、そのキャビティーの内圧上昇にあることを示した。 すなわち、薄膜中に発現したキャビティーは、ボイドの凝集と、その内部に析出した He によって形成された He ガスバブルであることが明らかになった。

更に、薄膜表面を FIB-SEM によって観察したところ、Figure 4 に示すように、ステップのそここに、多数の空孔が発生していた。こ



、 $UO_2$ 多結晶試料を用いた He 析出試験後の結晶粒表面でも観察されており、加熱時に濃度勾配に沿って、拡散した He の析出に起因するブリスタの痕跡であると考えられる $^{[5]}$ 。更に薄膜表面を拡大した Figure 5 によれば、空孔のエッジは、概ね直線的であり、表面下の負結晶形成が疑われるが、ブリスタ破裂後にステップ成長が発生した可能性があるため、現状では判別できない。

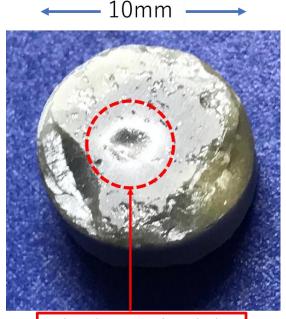
#### 4. 今後の予定

昨年度の経験から、台風とそれ伴う長期間 におよぶ曇天の気象条件下では、本研究で必 要とするバルクサイズの CeO<sub>2</sub> 作成は困難で あると考え、太陽炉の使用は断念する。その 代替装置として、今年度新規採択された科研 費 B「核形成機構に着目した He ガスバブルサ イズ制御法の確立によるスエリングの抑制」研 究課題番号:17H03524(代表:芹澤弘幸)の予 算を用いてキセノン型超高温炉を購入する。 キセノン型超高温炉の加熱原理は太陽炉と同 じであり、酸化雰囲気中でも試料を高温加熱 出来ることがその特徴である。同装置を用い てアルミナを溶解することができることから、 仕様上、試料の輻射率が低くとも、2000℃以 上まで加熱できることが可能であるとされて いる。該当装置を用いて、試験的に CeO2ペレ ットの加熱試験を実施したところ、出力設定 値 60%では、数分で CeO2ペレット表面が溶解、 蒸発させてしまう能力を有していることを確 認した。次に出力を40%に落として5分間加 熱試験を実施したところ、Figure 6 に示すよ

Figure 6. Heat treated sample by Xe-type high temperature furnace

表

面にガラス状の部分が形成されていることを 確認した。中央部のくぼみは、溶解した痕跡



A focal point of Xe light

## [H27-6]

である。本装置では、焦点サイズの調整も可能であるので、今年度調整試験を進めて、 Spring8を用いてガラス状の部分の分析を実施する。

#### 5. 謝辞

キセノン型超高温加熱炉による CeO<sub>2</sub>加熱予備試験にご協力いただいた、同機製造元の株式会社クリスタルシステム様に感謝いたします。

#### 参考文献

- [1] Sattonnay, G.et al. *Philos. Mag. Lett.* **84**, 109-115 (2004).
  - [2]Sauvage, T. et al. *Nucl. Instr. Meth. in Phys. Res. B* **240**, 271-276 (2005)
  - [3] Maugeri, E. et al. J. Nucl. Mater. 385, 461-466 (2009).
  - [4] Yun, Y.et al. J. Nucl. Mater. 385, 364-367 (2009).
  - [5] Serizawa, H., et al., J. Asian Ceram. Soc.1, 289-295(2013)
  - [6] Serizawa, H.et al., Cryst. Growth Des. **13** , 2815-2823(2013)
  - [7] Castel M. R., Phys. Rev. B. 68, 235411-235417(2003)